

三菱化学 Loresta-AX

手持式低阻率计 MCP-T370 (替换 MCP- T360)



特点：

MCP-T370 四探针恒定电流测试原理；

一触式高精度测量各种材料的表面电阻率。

查找只需按下启动按钮，确认自动测量功能，可自动保持当前的测量值。

电池寿命可以采用镍氢电池组可以方便地替换。

新增探头校准模式。

检查探头校准片（另售），以确认 Loresta-AX(MCP-T370)测试值的准确性。

测量数据可以导出到 USB 存储器

可配置多种探头测量低阻抗

MCP 探头

- 一次接触样品，即可完成测量
- 内置电流钎铜镀金高质量探针，压力恒定
- 定内阻和导线阻抗已经消除

应用范围：

导电性油漆，导电性糊状物，导电性塑料，导电性橡胶，导电性薄膜，金属薄膜，抗静电材料，EMI 防护材料，导电性纤维，导电性陶瓷，光伏行业等。

应用于低阻抗测量范围，带 4 针探头

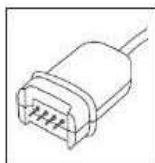
测量范围： $1.999 \times (10^{-2} \sim 10^6) \Omega$ **三种单位互转：** Ω 、 $\Omega/\square$ 、 $\Omega \cdot \text{cm}$

用途

工业生产、质量控制、研发

选件：

■ 四探針探頭 ■



W39xL20xH55mm
各 Pin 之間隔 5mm



ASP 探頭

● 利用價格廣泛標準探頭
JISK7 194 對應・Pin 間 5mm
Pin 尖 0.37R x 4 支・壓力 210g/支
RMH110(MCP-TP03P)



ESP 探頭

● 不均一樣品用
Pin 間 5mm・Pin 尖 $\phi 2 \times 4$ 支
壓力 240g/支
RMH114(MCP-TP08P)



LSP 探頭

● Soft samples 用
Pin 間 5mm・Pin 尖 $\phi 2 \times 4$ 支
壓力 130g/支
RMH116(MCP-TP1SP)



ϕ 10-20xL112mm



PSP 探頭

● 小樣品或薄膜用
Pin 間 1.5mm・Pin 尖 0.26R x 4 支
壓力 70g/支
RMH112(MCP-TP06P)



QPP 探頭

● 微小樣品用
Pin 間 1.5mm・Pin 尖 0.26R x 4 支
壓力 70g/支
RMH115(MCP-TPQPP)

特殊用探頭



BSP 探頭

● 大樣品用
Pin 間 2.2mm・Pin 尖 0.37R x 4 支
壓力 210g/支
RMH111(MCP-TP05P)



TFP 探頭

● Silicone wafer 或玻璃基板上之薄膜用
Pin 間 1.0mm・Pin 尖 0.15R x 4 支
壓力 50g/支
RMJ217(MCP-TFP)



NSCP 探頭

● Hard 樣品用・Silicone wafer 用
Pin 間 1.0mm・Pin 尖 0.04R x 4 支
壓力 250g/支
RMJ202(MCP-NSCP)